

# Cu基板上薄膜残留物の分析

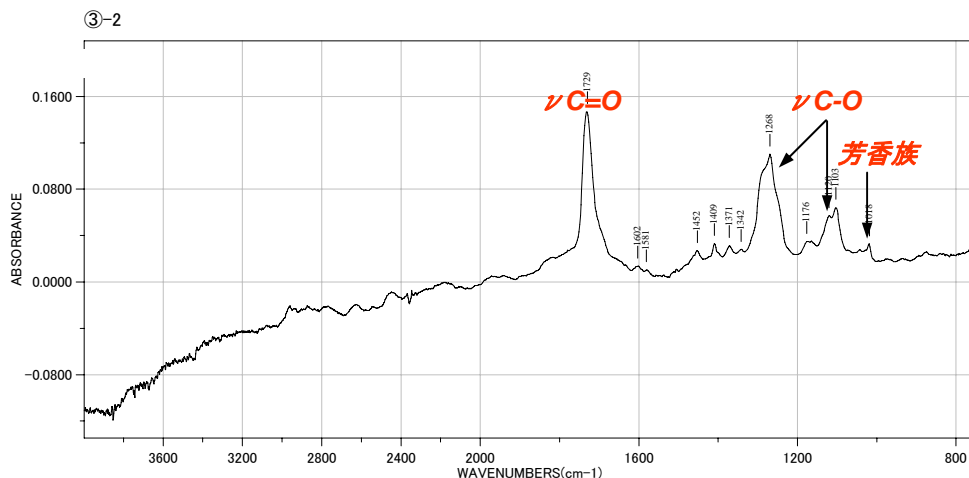
## <分析手法> FT-IR

Cu基板上の薄膜残留物が何かを調べるため、顕微FT-IR(フーリエ変換-赤外分光)高感度反射法を用いて、分析を実施しました。

## <結果>

薄膜残留物(厚み: 0.5  $\mu$ m程度)はPET\*であり、基板表面フィルム由来であることが判明しました。

\* PET: ポリエチレンテレフタレート



## Cu 基板上の薄膜残留物の 赤外吸収スペクトル